

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ШУНГИТОВОГО УГЛЕРОДА

Л. С. Парфеньев, И. А. Смирнов, А. З. Зайденберг,
Н. Н. Рожкова, Г. Б. Стефанович

Шунгиты являются весьма специфическими природными углеродосодержащими образованиями, формирование которых происходило более двух миллиардов лет тому назад [1,2]. В высокоуглеродистых шунгитах углерод часто присутствует в виде глобул разметод 100–200 Å. Во всех типах шунгитов присутствует большое число примесей (основными являются примеси V, Ni, Cu, Fe).

Постановку и проведение настоящего исследования стимулировали два экспериментальных факта, обнаруженных в шунгитах: 1) в [3] было показано, что высокоуглеродистые шунгиты содержат в небольшом количестве природные фуллерены C_{60} и C_{70} ; 2) в [4] также в высокоуглеродистом шунгите в области температур 200 K был обнаружен пик затухания ультразвуковых волн, который сопровождался аномальным возрастанием скорости упругих волн.

Аномалии ряда физических параметров при температурах 260 и 160 K были обнаружены и в фуллерене C_{60} [5]. Они связывались с наличием структурного фазового перехода (при 260 K) и с изменением характера вращения углеродных молекул (при $\sim 160 \div 180$ K) [5]. Для фуллера C_{60} также интересна температура $\sim 77 \div 90$ K, которая соответствует температуре «стеклования» C_{60} , при которой «замораживаются» вращения углеродных молекул [5,6].

В настоящей работе мы измерили в интервале температур 77–400 K электропроводность σ двух образцов шунгитов с содержанием углерода 30% (Ш-30) и 98% (Ш-98). Исследовались образцы соответственно с размерами 9×9×20 и 5×5×5 mm. Измерения σ проводились на посто-

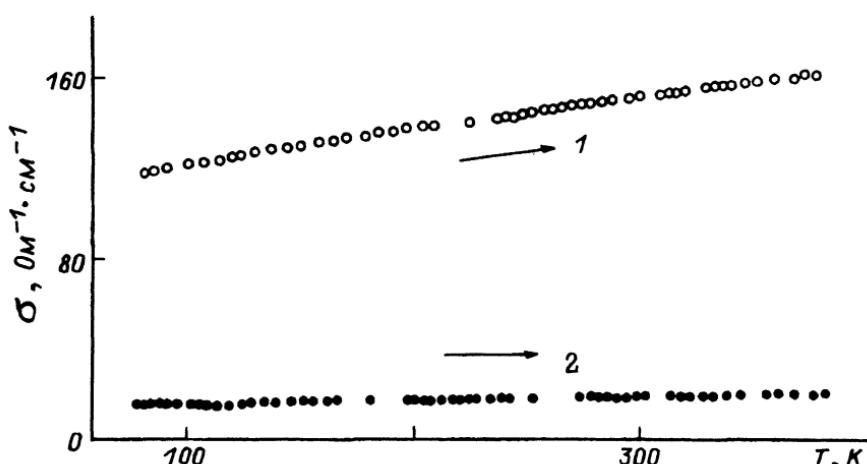


Рис. 1. Температурная зависимость электропроводности шунгитов с содержанием углерода 98% (Ш-98) (1) и 30% (Ш-30) (2).

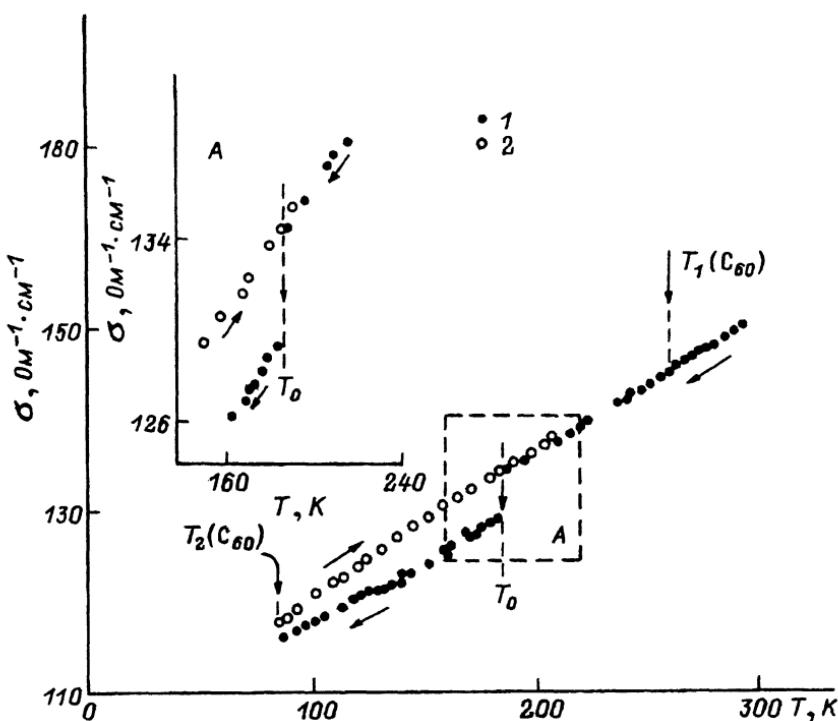


Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности шунгита Ш-98 при охлаждении от 300 К (1) и нагреве от 77 К (2).

янном токе четырехзондовым методом. Относительная погрешность эксперимента составляла 0.2%.

На рис. 1 приведены данные для $\sigma(T)$ образцов Ш-98 (1) и Ш-30 (2). Измерения проводились при нагреве образцов от температуры жидкого азота до 400 К. Как видно из этого рисунка, никаких аномалий на зависимости $\sigma(T)$ не обнаруживается. В случае же измерения σ образца Ш-98 при понижении температуры от 300 до 77 К в районе ~ 180 К на зависимости $\sigma(T)$ обнаруживаются аномалии: либо пологая «полочка», либо скачок σ . При этом наблюдается гистерезис $\sigma(T)$ и на обратном ходе от 77 к 300 К вновь никаких аномалий в районе 180 К не проявляется. На рис. 2 для примера приведен случай аномалии в $\sigma(T)$ при $T \approx 180$ К в виде скачка.

Какова физическая причина обнаруженной аномалии в $\sigma(T)$? Пока что однозначного ответа на это мы дать не можем. Возможны две гипотезы для объяснения обнаруженного эффекта:

1) В образце Ш-98 имеется большая концентрация естественных фуллеренов C_{60} (порядка процентов), и все аномалии обязаны их наличию в образце шунгита. Однако все имеющиеся к настоящему времени литературные данные указывают на то, что в шунгитах концентрация фуллеренов C_{60} и C_{70} не превышает 10^{-3} .

2) Возможно, что обнаруженные аномалии в $\sigma(T)$ и затухании ультразвуковых волн [4] в шунгите Ш-98 и аномалии ряда физических параметров фуллерена $\sigma(T)$ [5] в области 160–180–200 К обусловлены об-

щими (или близкими) процессами, происходящими в углеродных материалах: «шариков» фуллерена C₆₀ и глобул шунгита Ш-98.

Выяснению правомерности этого предположения будут посвящены наши дальнейшие исследования шунгитов.

Авторы благодарят В.В.Леманова за полезное обсуждение статьи и И.Н.Куликову за помощь в измерениях.

Работа проводилась в рамках программы фонда интеллектуального сотрудничества «Фуллерены и атомные кластеры», поддержанной Министерством науки и технической политики Российской Федерации.

Список литературы

- [1] Шунгитовые породы Карелии. Петрозаводск, Карельский филиал АН СССР, Институт геологии, 1981. С. 585.
- [2] Шунгиты — новое углеродистое сырье. Петрозаводск, Карельский филиал АН СССР, Институт геологии, 1984. С. 182.
- [3] Buseck P.R., Tsipursky S.J. // Science. 1992. V. 257. P. 215–217.
- [4] Леманов В.В., Балошова Е.В., Шерман А.В., Зайденберг А.З., Рожкова Н.Н. // ФТТ. 1993. Т. 35. № 12. С. 0000–0000.
- [5] Moret R., Albouy P.A., Agafonov V., Ceolin R., Andre D., Dvorkin A., Szwarc H., Fabre C., Rassat A., Zahab A., Bernier P. // J. Phys. France. 1992. V. 2. N 5. P. 511–515.
- [6] Matsuo T., Suga H., David W.I.F., Ibberson R.M., Bernier P., Zahab A., Fabre C., Rassat A., Dworkin A. // Solid State Comm. 1992. V. 83. N 9. P. 711–715.

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Институт геологии РАН
Петрозаводск

Поступило в Редакцию
30 августа 1993 г.